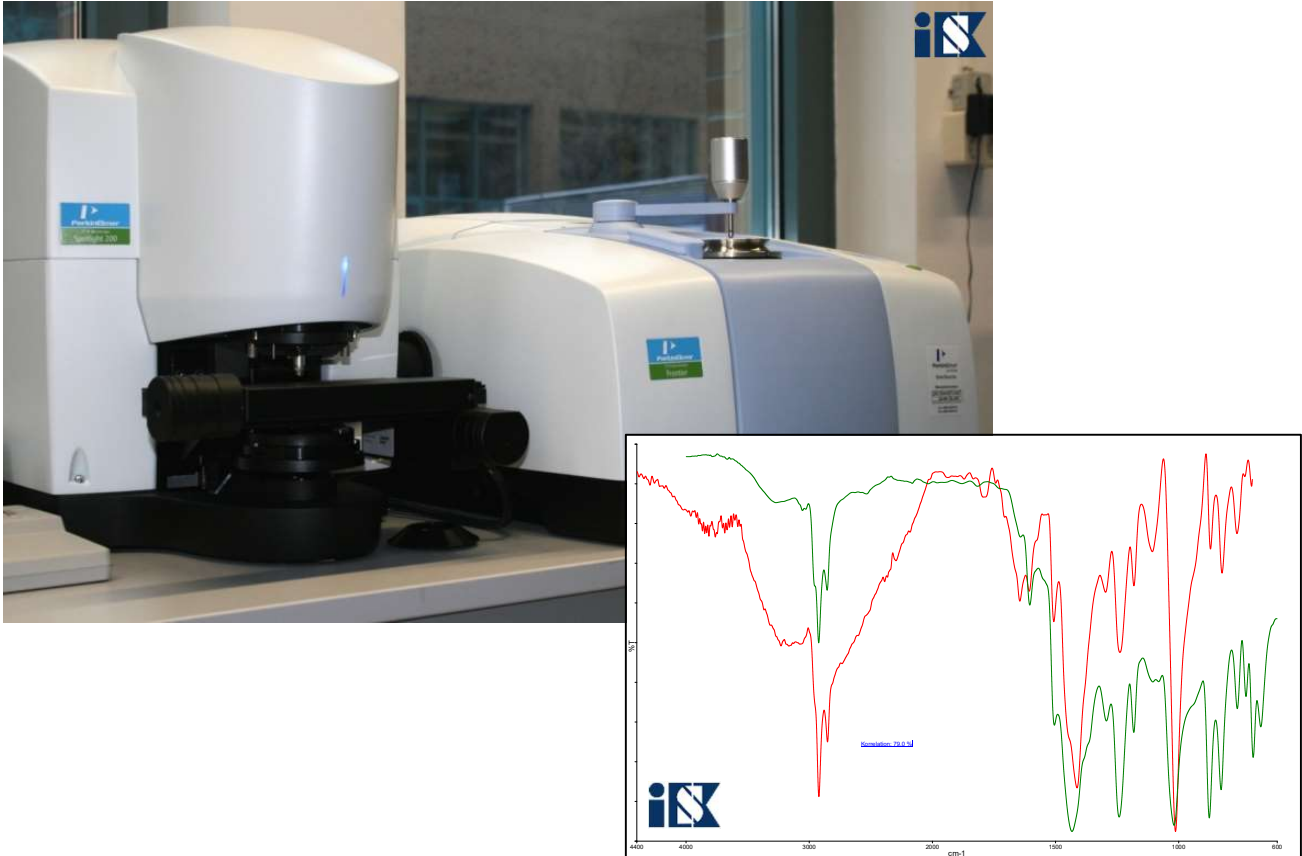


Infrarot-Spektroskopie und -Mikroskopie



Infrarot-Mikroskop Spotlight 200 IR Mikroskop mit Frontier FTIR-Spektrometer der Perkin Elmer LAS (Germany) GmbH

- Aufnahme von IR-Spektren zur Analyse von Beschichtungen und Klebstoffen
- Messung in Transmission, Reflexion und mittels ATR-Kristall
- Wellenzahlbereich: 400 – 4000 cm^{-1}
- Durch Mikroskopie-Einheit sind Oberflächenbereiche von (10 x 10) μm gezielt auswählbar und analysierbar.